	△の数	訂　正　記　事	設計	検図	年月日		△の数	訂　正　記　事	設計	検図	年月日
△1	1	DIS-H-03768(06159)	梅原		04.09.29	△					
△						△					

適用規格				
定格	使用温度範囲	－３５℃～＋８５℃(注１)	保存温度範囲	－１０ ℃ ～＋６０ ℃
	電　圧	ＡＣ　２５０Ｖ	適合コネクタ	ＤＦ１Ｂ－２０Ｓ－２．５Ｒ
	電　流	AWG20～24:　3A AWG26:　2A AWG28:　1A AWG30:0.5A		

性　能

	項　目	試　験　方　法	規　格	QT	AT
構造	外観，構造及び仕上げ	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表　示	目視にて確認する。		○	○
電気的性能	低電圧，低電流下の接触抵抗	100mA　(DC又は1000 Hz)で測定する。	30 mΩ以下	○	－
	絶　縁　抵　抗	DC　500 Vで測定する。	1000 MΩ以上	○	－
	耐　電　圧	AC　650 Vの電圧を１分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	－
機械的性能	繰り返し動作	30　回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗: 30 mΩ以下 ② 破損，ひび，部品のゆるみがないこと。	○	－
	耐　振　性	周波数 10 ～ 55 Hz，片振幅0.75mmで3方向 各2時間試験する。	① 1 μs以上の電気的瞬断がないこと. ② 破損，ひび，部品のゆるみがないこと。	○	－
	耐　衝　撃　性	加速度 490 m/s², 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	① 1 μs以上の電気的瞬断がないこと. ② 接触抵抗: 30 mΩ以下 ③ 破損，ひび，部品のゆるみがないこと。	○	－
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃，湿度 90～95% 中に96 時間放置する。	① 接触抵抗:　30 mΩ以下 ② 絶縁抵抗:　1000 MΩ以上 △1 ③ 破損，ひび，部品のゆるみがないこと。	○	－
	温度サイクル	温度 -55 → 5～35 → 85 → 5～35 ℃ 時間　30 → 5以内 → 30 → 5以内 分 を 5 サイクル試験する。	① 接触抵抗:　30 mΩ以下 ② 絶縁抵抗:　1000 MΩ以上 ③ 破損，ひび，部品のゆるみがないこと。	○	－
	はんだ耐熱性	【フロー半田付けの場合】 はんだ温度　260 ℃，5 秒間で試験する。 【手半田付けの場合】 はんだこて温度　300℃，3秒で試験する。 但し、端子に力を加えないこと。	外観の変形及び端子などの著しいガタがないこと。	○	－
	はんだ付け性	はんだ温度　235 ℃，浸積時間　5 秒間のはんだ付けを行う。	半田浸せき面の 95% 以上が新しいはんだでぬれていること。	○	－

備考　(注１)通電による温度上昇を含む。

試験規格の記載のない試験方法は JIS-C-5024を適用している。

製図	設計	検図	承認	出図
NC	NC	NC	NC	
'03.04.02	'03.04.04	'03.04.23	'03.04.23	
松木	伝法谷	宮崎	宮崎	

注　QT:確認試験　AT:製品検査　○:適用項目

HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	製品規格表	製品名 ＤＦ１ＢＺ－２０Ｐ－２．５ＤＳＡ
旧CL CL	図番 ＳＬＣ４－３０１７９７－００	製品コード ＣＬ５４１－２０１６－８

1/1

技書規２３１－１

NC

TO
NC

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。